# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-160566

(43) Date of publication of application: 19.06.1998

(51)Int.CI.

G01J 1/42

G01J 1/44 G01J 5/48

(21)Application number: 08-322794

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

03.12.1996

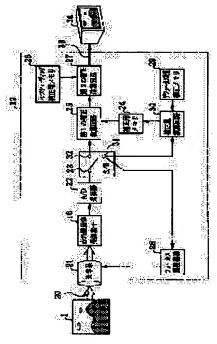
(72)Inventor: YAMADA YOSHIHIRO

**UCHIYAMA HIROYUKI** 

# (54) INFRARED-RAY IMAGE PICKUP DEVICE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress a lens shading occurring due to the difference in lens shading between the time when the background is made out-of-focus and when the focus is placed on an object, by eliminating a peculiar lens shading pattern occurring at the time of defocusing. SOLUTION: A correction quantity arithmetic circuit 30 substrates the data of a defocusing correction memory 29 from the output of a A/D-converter 22 and stores the shading component except for the lens shading at the time of defocusing in a correction memory 24. A switch is switched to a contact point 32, and the first correction arithmetic circuit 25 subtracts the data of the correction memory 24 from the output of the A/D-converter 22. The second correction arithmetic circuit 27 subtracts the data of a lens shading correction memory 26 storing the lens shading when the focus is placed on an object from the output of the first correction arithmetic circuit 25.



The video signal 33 corrected with shading is outputted from the second correction arithmetic circuit 27.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office



# (19) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-160566

(43) 公開日 平成10年(1998)6月19日

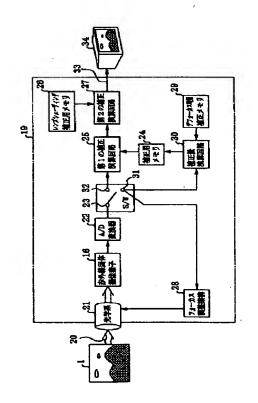
			(43)公開日 平成10年(1998)6月19日
(51) Int. Cl. 6	識別記号	FΙ	
G 0 1 J	1/42	G01J	1/42 B
	1/44		1/44 P
	5/48		5/ <b>4</b> 8 D
	·		
	審査請求 未請求 請求項の数7	OL	(全16頁)
(21)出願番号	特願平8-322794	(71)出願人	
(22)出願日	平成8年(1996)12月3日		三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
: .		(72)発明者	山田 善博 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱 電機株式会社内
		(72) 発明者	内山 裕之 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱 電機株式会社内
		(74)代理人	弁理士 宮田 金雄 (外2名)

# (54) 【発明の名称】赤外線撮像装置

# (57)【要約】

【課題】 対象物体の背景を十分にぼかした時と、対象 物体に焦点を合わせた時とでレンズシェーディングが異 なることによって発生するレンズシェーディングを抑え る手段を提供することを目的とする。

【解決手段】 この発明の実施の形態1によれば、背景を十分にぼかした時と、対象物体に焦点を合わせた時とのレンズシェーディングメモリを持つことによりレンズシェーディングを抑圧することができる。



40

# 【特許請求の範囲】

赤外線を集光する光学系と、この光学系 【請求項1】 で集光された赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子 と、この赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA /D変換するA/D変換器と、レンズシェーディングを 除いた残りのシェーディング成分等を記憶させる時とビ デオ信号を出力させる時とを切替えるスイッチと、レン ズシェーディングを除いた残りのシェーディング成分等 を記憶する補正用メモリと、前記A/D変換器の出力を この補正用メモリのデータをもとに補正する第1の補正 演算回路と、前記光学系のレンズシェーディングパター ンを記憶しているレンズシェーディング補正用メモリ と、前記第1の補正演算回路の出力をレンズシェーディ ング補正用メモリのデータをもとにレンズシェーディン グを補正する第2の補正演算回路と、レンズシェーディ ングを除いた残りのシェーディング量等を測定するため 前記光学系のフォーカスをぼかすフォーカス調整機構 と、フォーカスをぼかした時に発生する特有のレンズシ ェーディングパターンを記憶しているデフォーカス時用 補正メモリと、このデフォーカス時用補正メモリのデー タをもとにフォーカスをぼかしたときに発生する特有の レンズシェーディングパターンを除いた残りのシェーデ ィング量等を測定する補正量演算回路とを備えたことを 特徴とする赤外線撮像装置。

1

【請求項2】 赤外線を集光する光学系と、この光学系 で集光された赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子 と、この赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA /D変換するA/D変換器と、レンズシェーディングを 除いた残りのシェーディング成分等を記憶させる時とビ デオ信号を出力させる時とを切替えるスイッチと、レン ズシェーディングを除いた残りのシェーディング成分等 を記憶する補正用メモリと、前記A/D変換器の出力を この補正用メモリのデータをもとに補正する第1の補正 演算回路と、前記光学系のレンズシェーディングパター ンを記憶しているレンズシェーディング補正用メモリ と、前記第1の補正演算回路の出力をレンズシェーディ ング補正用メモリのデータをもとにレンズシェーディン グを補正する第2の補正演算回路と、レンズシェーディ ングを除いた残りのシェーディング量等を測定するため 前記光学系の一部に組み込むデフォーカス用レンズ群 と、このデフォーカス用レンズ群を前記光学系の一部に 組み込むための機構であるデフォーカス用レンズ駆動機 構と、前記デフォーカス用レンズ群を挿入した時にのみ 発生する特有のレンズシェーディングパターンを記憶し ているデフォーカスレンズシェーディング補正用メモリ と、このデフォーカスレンズシェーディング補正用メモ リのデータをもとに前記デフォーカス用レンズ群を挿入 したときにのみ発生する特有のレンズシェーディングを 除いた残りのシェーディング量等を測定する補正量演算 回路とを備えたことを特徴とする赤外線撮像装置。

【請求項3】 赤外線を集光する光学系と、この光学系 で集光された赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子 と、この赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA /D変換するA/D変換器と、レンズシェーディングを 除いた残りのシェーディング成分等を記憶させる時とビ デオ信号を出力させる時とを切替えるスイッチと、レン ズシェーディングを除いた残りのシェーディング成分等 を記憶する補正用メモリと、前記A/D変換器の出力を この補正用メモリのデータをもとに補正する第1の補正 演算回路と、前記光学系のレンズシェーディングパター ンを記憶しているレンズシェーディング補正用メモリ と、前記第1の補正演算回路の出力をレンズシェーディ ング補正用メモリのデータをもとにレンズシェーディン グを補正する第2の補正演算回路と、前記光学系の一部 である通常レンズ群と、この通常レンズ群と同等の透過 率を有し、レンズシェーディングを除いた残りのシェー ディング量等を測定するため通常レンズ群の代わりに挿 入するデフォーカス用レンズ群と、前記通常レンズ群と このデフォーカス用レンズ群とを切替える機構であるレ ンズ切換え機構と、前記デフォーカス用レンズ群を挿入 した時にのみ発生する特有のレンズシェーディングパタ ーンを記憶しているデフォーカスレンズシェーディング 補正用メモリと、このデフォーカスレンズシェーディン グ補正用メモリのデータをもとにレンズシェーディング を除いた残りのシェーディング量等を測定する補正量演 算回路とを備えたことを特徴とする赤外線撮像装置。

【請求項4】 赤外線を集光する複数の光学系と、この 複数の光学系を切換える視野切換え機構と、前記光学系 で集光された赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子 と、この赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA /D変換するA/D変換器と、レンズシェーディングを 除いた残りのシェーディング成分等を記憶させる時とビ デオ信号を出力させる時とを切替えるスイッチと、レン ズシェーディングを除いた残りのシェーディング成分等 を記憶する補正用メモリと、前記A/D変換器の出力を この補正用メモリのデータをもとに補正する第1の補正 演算回路と、前記複数の光学系のレンズシェーディング パターンを記憶している複数のレンズシェーディング補 正メモリと、この複数のレンズシェーディング補正メモ リを切換えるメモリ切換えスイッチと、前記第1の補正 演算回路の出力をメモリ切換えスイッチによって切換え られた前記レンズシェーディング補正メモリのデータを もとにレンズシェーディングを補正する第2の補正演算 回路と、レンズシェーディングを除いた残りのシェーデ ィング量等を測定するため前記光学系のフォーカスをぼ かすフォーカス調整機構と、フォーカスをぼかした時に 発生する特有のレンズシェーディングパターンを記憶し ているデフォーカス時用補正メモリと、このデフォーカ ス時用補正メモリのデータをもとにフォーカスをぼかし 50 たときに発生する特有のレンズシェーディングパターン

を除いた残りのシェーディング量等を測定する補正量演 算回路とを備えたことを特徴とする赤外線撮像装置。

【請求項5】 赤外線を集光する光学系と、この光学系 で集光された赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子 と、この赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA /D変換するA/D変換器と、レンズシェーディングを 除いた残りのシェーディング成分等を記憶させる時とビ デオ信号を出力させる時とを切替えるスイッチと、レン ズシェーディングを除いた残りのシェーディング成分等 を記憶する鏡筒シェーディング補正用メモリと、前記A /D変換器の出力をこの鏡筒シェーディング補正用メモ リのデータをもとに補正する第3の補正演算回路と、前 記光学系のレンズシェーディングパターンを記憶してい るレンズシェーディング補正用メモリと、前記第3の補 正演算回路の出力をこのレンズシェーディング補正メモ リのデータをもとにレンズシェーディングを補正する第 2の補正演算回路と、前記光学系の前部に挿入する反射 率が高いシャッターと、このシャッターを前記光学系の 前部へ出し入れする機構であるシャッター開閉機構と、 前記シャッターが挿入されている時にレンズシェーディ ングを除いた残りのシェーディング量等を測定する鏡筒 シェーディング測定回路とを備えたことを特徴とする赤 外線撮像装置。

【請求項6】 シャッター形状が入射する光線と反射される光線とが同一方向になるようなシャッターを備えたことを特徴とする請求項5に示す赤外線撮像装置。

【請求項7】 シャッターの反射方向に低温物体を配置 する事を特徴とする請求項5に示す赤外線撮像装置。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、赤外線撮像装置によって撮像された画像に発生するシェーディングを補正し、安定した画像を得るための赤外線撮像装置に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】赤外線撮像装置によって撮像された画像発生するシェーディングを補正する方法として従来から、フォーカス位置を変えることにより補正する方法と、光学系の前面にシャッター等の均一な表面温度の物体を置くことにより補正する方法とがある。フォーカス位置を変えることによりシェーディングを補正する従来技術として、例えば特開平5-292403及び特開平3-278680等がある。図15は、特開平5-292403で示されているシェーディングの補正方法である。1は対象物体と対象物体の背景とから構成された外界、2は対象物と対象物体の背景とから放射される赤外線を集光するレンズ、3はレンズ2を介して対象物体と対象物体の背景とに対応する映像データを出力する撮像部、4は補正データを記憶しておく補正データ記憶部である。図16は、特開平3-278680で示されてい

る赤外線受光素子の特性はらつきに起因する映像信号のはらつきを補正する方法に関するものである。5は複数の画素からなる赤外線検出素子、6は受光面位置に第1像面をもつ第1レンズ系、7は第1レンズ系と同一光軸上にある第2レンズ系、8は第2レンズ系の結像位置である。

【0003】光学系の前面にシャッター等の均一表面温度の物体を置くことによりシェーディングを補正する従来技術として、例えば特開平5-149792に示された手法がある。図17は特開平5-149792に従来技術として記述されている赤外線センサの各画素の特性のばらつきを補正する補正機能を設けた赤外線撮像装置を示すブロック図である。9はセレクタ、10は減算器、11はテレビ信号用フォーマット変換器、12はフレームメモリ、13は補正制御器、14はシャッタ、15はシャッタ駆動器、16は赤外線固体撮像素子、17は赤外線レンズ、18は信号処理系である。

【0004】次に図15の動作について説明する。まず、撮像部3で、レンズ2の焦点をぼかして背景に対応 する映像データだけを補正データとして出力し、補正データ記憶部4に記憶しておく。次に、撮像状態で、対象物体に焦点を合わせて、撮像部3から出力する対象物体と対象物体の背景とに対応する映像データに対して、補正データ記憶部4に記憶した補正データを読み出して補正データにより補正する。

【0005】次に図16の動作について説明する。まず、複数の赤外線受光素子からなる赤外線検出素子5と、前記検出素子の受光面位置に第1像面をもつ第1レンズ系6とを備える赤外線撮像装置において、前記第1レンズ系の代わりに同一の軸上にある第2レンズ系7を用い、第2レンズ系の結像面にある第2像面8の位置を前記受光面位置と異なる位置にすることにより得られる前記検出素子の出力信号を用いて、各受光素子間の特性の違いに起因する映像信号のばらつきを電気的に補正する。

【0006】次に図17の動作について説明する。まず、撮像するに当たって補正を実行する。そのときには、補正制御器13の指令によってシャッター駆動器15が、シャッター14を閉じ、また、セレクタ9は、そ40の方向をフレームメモリ側12に切り換える。シャッター14は均一な表面温度であり、かつ均一な赤外線か射パターンとなるように作られているので、赤外線レンズ17を通して赤外線固体撮像素子16に受光される赤外線強度は均一となる。フレームメモリ12にはこの時の映像が記憶されることになるが、赤外線固体撮像素子16の各画素は均一な赤外線強度一電気信号変換特性でないため、フレームメモリ12には各画素の赤外線強度一電気信号特性の不均一さが記憶される。次に、実際の撮像対象を撮像する場合には、補正制御器13の指令によってシャッタ駆動器15がシャッタ14を開き、またセ

30

50

レクタ9は、その方向を減算器10に切り換える。赤外 線レンズ7を通して赤外線個体素子16に受光される撮 像対象の赤外線映像はその強度に応じた電気信号に変換 される。減算器10においてフレームメモリ12からの 出力と減算される。前述したように、フレームメモリ1 2には各画素毎の赤外線強度-電気信号変換特性の不均 一さが記憶されているので、減算器10の出力では純粋 に撮像対象の赤外線映像だけとなる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】図15に示した従来の シェーディング補正方法では、被写界深度が深いレンズ 構成の撮像装置では、焦点を十分ぼかすことは不可能で ある。さらに、十分にぼかしたとしても、十分にぼけた 時と対象物体に焦点を合わせた時とでは、レンズシェー ディングが異なり、これによりレンズシェーディングが 発生する。

【0008】また図16に示した手法では、新たな光学 系を挿入するため、挿入前後でレンズシェーディングが 異なり、結果としてレンズシェーディングが発生する。 また、新たに挿入したレンズ面の透過率が1でないため 鏡筒を反射し、レンズ挿入前後では鏡筒シェーディング が異り、結果として鏡筒シェーディングが発生する。

【0009】更に図17に示した手法では、シャッター が均一な表面温度であり、なおかつ均一な赤外線放射パ ターンとなるように作られていたとしても、背景温度と シャッター温度とが異なった場合には、シェーディング は発生してしまう。また、シャッターを均一な表面温度 とすることは装置の構成上難しい。

【0010】この発明はかかる課題を解決するためにな されたものであり、対象物体の背景を十分にぼかした時 と、対象物体に焦点を合わせた時とでレンズシェーディ ングが異なることによって発生するレンズシェーディン グを抑える手段、被写界深度が深いレンズ構成の撮像装 置で、焦点を十分ぼかすことが不可能な装置でもシャッ ターを用いることなしにシェーディングを抑えることが できる手段、背景温度とシャッター温度とが異なること によって発生する鏡筒シェーディングを抑える手段を提 供することを目的とする。

### [0011]

【課題を解決するための手段】この発明の実施形態1に よる赤外線撮像装置は、赤外線を集光する光学系と、こ の光学系で集光された赤外線を光電変換する赤外線固体 撮像素子と、この赤外線固体撮像素子で光電変換された 出力をA/D変換するA/D変換器と、レンズシェーデ ィングを除いた残りのシェーディング成分等を記憶させ る時とビデオ信号を出力させる時とを切替えるスイッチ と、レンズシェーディングを除いた残りのシェーディン グ成分等を記憶する補正用メモリと、前記A/D変換器 の出力をこの補正用メモリのデータをもとに補正する第 1の補正演算回路と、前記光学系のレンズシェーディン

グパターンを記憶しているレンズシェーディング補正用 メモリと、前記第1の補正演算回路の出力をレンズシェ ーディング補正用メモリのデータをもとにレンズシェー ディングを補正する第2の補正演算回路と、レンズシェ ーディングを除いた残りのシェーディング量等を測定す るため前記光学系のフォーカスをぼかすフォーカス調整 機構と、フォーカスをぼかした時に発生する特有のレン ズシェーディングパターンを記憶しているデフォーカス 時用補正メモリと、このデフォーカス時用補正メモリの データをもとにフォーカスをぼかしたときに発生する特 有のレンズシェーディングパターンを除いた残りのシェ ーディング量等を測定する補正量演算回路とにより構成 したものである。

【0012】この発明の実施形態2による赤外線撮像装 置は、赤外線を集光する光学系と、この光学系で集光さ れた赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子と、この 赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA/D変換 するA/D変換器と、レンズシェーディングを除いた残 りのシェーディング成分等を記憶させる時とビデオ信号 を出力させる時とを切替えるスイッチと、レンズシェー ディングを除いた残りのシェーディング成分等を記憶す る補正用メモリと、前記A/D変換器の出力をこの補正 用メモリのデータをもとに補正する第1の補正演算回路 と、前記光学系のレンズシェーディングパターンを記憶 しているレンズシェーディング補正用メモリと、前記第 1の補正演算回路の出力をレンズシェーディング補正用 メモリのデータをもとにレンズシェーディングを補正す る第2の補正演算回路と、レンズシェーディングを除い た残りのシェーディング量等を測定するため前記光学系 の一部に組み込むデフォーカス用レンズ群と、このデフ ォーカス用レンズ群を前記光学系の一部に組み込むため の機構であるデフォーカス用レンズ駆動機構と、前記デ フォーカス用レンズ群を挿入した時にのみ発生する特有 のレンズシェーディングパターンを記憶しているデフォ ーカスレンズシェーディング補正用メモリと、このデフ ォーカスレンズシェーディング補正用メモリのデータを もとに前記デフォーカス用レンズ群を挿入したときにの み発生する特有のレンズシェーディングを除いた残りの シェーディング量等を測定する補正量演算回路とにより 40 構成したものである。

【0013】この発明の実施形態3による赤外線撮像装 置は、赤外線を集光する光学系と、この光学系で集光さ れた赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子と、この 赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA/D変換 するA/D変換器と、レンズシェーディングを除いた残 りのシェーディング成分等を記憶させる時とビデオ信号 を出力させる時とを切替えるスイッチと、<u>レンズシェー</u> ディングを除いた残りのシェーディング成分等を記憶す る補正用メモリと、前記A/D変換器の出力をこの補正 用メモリのデータをもとに補正する第1の補正演算回路

(5)

8

と、前記光学系のレンズシェーディングパターンを記憶 しているレンズシェーディング補正用メモリと、前記第 1の補正演算回路の出力をレンズシェーディング補正用 メモリのデータをもとにレンズシェーディングを補正す る第2の補正演算回路と、前記光学系の一部である通常 レンズ群と、この通常レンズ群と同等の透過率を有し、 レンズシェーディングを除いた残りのシェーディング量 等を測定するため通常レンズ群の代わりに挿入するデフ オーカス用レンズ群と、前記通常レンズ群とこのデフォ ーカス用レンズ群とを切替える機構であるレンズ切換え 機構と、前記デフォーカス用レンズ群を挿入した時にの み発生する特有のレンズシェーディングパターンを記憶 しているデフォーカスレンズシェーディング補正用メモ リと、このデフォーカスレンズシェーディング補正用メ モリのデータをもとにレンズシェーディングを除いた残 りのシェーディング量等を測定する補正量演算回路とに より構成したものである。

【0014】この発明の実施形態4による赤外線撮像装 置は、赤外線を集光する複数の光学系と、この複数の光 学系を切換える視野切換え機構と、前記光学系で集光さ れた赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子と、この 赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA/D変換 するA/D変換器と、レンズシェーディングを除いた残 りのシェーディング成分等を記憶させる時とビデオ信号 を出力させる時とを切替えるスイッチと、レンズシェー ディングを除いた残りのシェーディング成分等を記憶す る補正用メモリと、前記A/D変換器の出力をこの補正 用メモリのデータをもとに補正する第1の補正演算回路 と、前記複数の光学系のレンズシェーディングパターン を記憶している複数のレンズシェーディング補正メモリ と、この複数のレンズシェーディング補正メモリを切換 えるメモリ切換えスイッチと、前記第1の補正演算回路 の出力をメモリ切換えスイッチによって切換えられた前 記レンズシェーディング補正メモリのデータをもとにレ ンズシェーディングを補正する第2の補正演算回路と、 レンズシェーディングを除いた残りのシェーディング量 等を測定するため前記光学系のフォーカスをぼかすフォ ーカス調整機構と、フォーカスをぼかした時に発生する 特有のレンズシェーディングパターンを記憶しているデ フォーカス時用補正メモリと、このデフォーカス時用補 正メモリのデータをもとにフォーカスをぼかしたときに 発生する特有のレンズシェーディングパターンを除いた 残りのシェーディング量等を測定する補正量演算回路と により構成したものである。

【 O O 1 5 】 この発明の実施形態 5 による赤外線撮像装置は、赤外線を集光する光学系と、この光学系で集光された赤外線を光電変換する赤外線固体撮像素子と、この赤外線固体撮像素子で光電変換された出力をA/D変換するA/D変換器と、レンズシェーディングを除いた残りのシェーディング成分等を記憶させる時とビデオ信号

を出力させる時とを切替えるスイッチと、レンズシェーディングを除いた残りのシェーディング成分等を記憶する鏡筒シェーディング補正用メモリと、前記A/D変換器の出力をこの鏡筒シェーディング補正用メモリのデータをもとに補正する第3の補正演算回路と、前記光学系のレンズシェーディングパターンを記憶しているレンズシェーディング補正メモリの第0の出力をこのレンズシェーディング補正メモリのデータをもとにレンズシェーディングを補正する第2の補正演算回路と、前記光学系の前部に挿入する反射率が高いシャッターと、このシャッターを前記光学系の前部に出し入れする機構であるシャッター開閉機構と、前記シャッターが挿入されている時にレンズシェーディングを除いた残りのシェーディング量等を測定する鏡筒シェーディング側定回路とにより構成したものである。

【0016】この発明の実施形態6による赤外線撮像装置は、シャッター形状が入射する光線と反射される光線とが同一方向になるようなシャッターと実施の形態5とにより構成したものである。

10 【0017】この発明の実施形態7による赤外線撮像装置は、シャッターの反射方向の低温物体と実施の形態5とにより構成したものである。

[0018]

【発明の実施の形態】

実施の形態1. 図1は、この発明の実施の形態1を示す ブロック図である。1及び16は、上記従来技術と同じ である。図1に示す実施の形態1において、19は赤外 線画像のビデオ信号を出力する赤外線撮像装置である。 20は外界1から発せられる赤外線放射である。21は 赤外線を集光する光学系、22は赤外線固体撮像素子1 6で光電変換された出力をA/D変換するA/D変換器 である。23はレンズシェーディングを除いた残りのシ ェーディング成分等を記憶させる時と、ビデオ信号を出 力させる時とを切替える切換えスイッチである。24 は、レンズシェーディングを除いた残りのシェーディン グ成分等を記憶する補正用メモリであり、25はA/D 変換器22の出力を補正用メモリ24のデータをもとに レンズシェーディングを除いた残りのシェーディング成 分等を補正する第1の補正演算回路である。26は、光 学系21が通常のフォーカス状態である時のレンズシェ ーディングパターンを記憶しているレンズシェーディン グ補正用メモリであり、27は第1の補正演算回路25 の出力をレンズシェーディング補正メモリ26のデータ をもとにレンズシェーディング補正する第2の補正演算 回路である。28は、光学系21のフォーカスを調整す る機構であるフォーカス調整機構、29はフォーカス調 整機構28により光学系21が十分にぼかされたときの レンズシェーディングパターンを記憶しているデフォー カス時用補正メモリである。30はデフォーカス時用補 正メモリ29のデータをもとにレンズシェーディングを

除いた残りのシェーディング量等を測定する補正量演算 回路である。また、31は切換えスイッチ23が補正量 演算回路30の方につながる第1の接点であり、32は 切換えスイッチ23が第1の補正演算回路25の方につ ながる第2の接点である。33は、補正が終了したビデ オ出力信号であり、34はビデオ出力信号33を表示す るモニタである。

【0019】以下に動作について説明する。対象物体と 対象物体の背景とから構成された外界1から発せられる 赤外線放射20は光学系21を通して赤外線固体撮像素 子16に結像する。赤外線固体撮像素子16では、入射 された放射照度に応じて光電変換を行う。A/D変換器 22では赤外線固体撮像素子16の出力をA/D変換す

【0020】まず、切換えスイッチ23を第1の接点3 1にし、補正用メモリ24に補正データを記憶するとき について説明する。切換えスイッチ23を第1の接点3 1にすると共に、フォーカス調整機構28により外界1 が赤外線個体撮像素子16上に結像しないように光学系 21を十分にぼかす。この時のA/D変換器22の出力 を図2に示す。また、図3には図2のA-A'の輝度分 布を示す。光学系21を十分ぼかしたときには赤外線個 体撮像素子16に受光される赤外線強度は均一となるは ずであるが、図3に示すような輝度分布を持つのは、素 子の感度ばらつき、暗電流のばらつき、鏡筒シェーディ ング、レンズシェーディング等のためである。デフォー カス時用補正メモリ29には、フォーカス調整機構28 により光学系21を十分にぼかしたとき特有のレンズシ ェーディングパターンが記憶されている。レンズシェー ディングパターンは光学系の設計段階で概ね分かり、レ ンズ作成後はそれを測定することも可能である。一般に 知られたレンズシェーディングパターンの記憶装置(メ モリ)には、赤外線固体撮像素子の各画素に対応したレ ンズシェーディングパターンが記憶されているのではな く、ある間隔で記憶されている。レンズシェーディング を補正するときにはこの記憶装置の値をもとに補間して 用いている。ここで、図2のA-A'に対応した部分の レンズシェーディングパターンの一例を図4に示す。

【0021】以下に、補正量演算回路30の動作に関し て説明する。補正量演算回路30では、A/D変換器2 2の出力からデフォーカス時用補正メモリ29のデータ を減算し、その結果を補正データとして補正用メモリ2 4に記憶させる。このときに記憶される内容は、デフォ ーカス時のレンズシェーディングを除いた残りのシェー ディングデータである。ここで、図5には補正用メモリ 24に記憶されている内容の一部分示す。

【0022】次に、切換えスイッチ23を第2の接点3 2にしビデオ信号を出力させる時について説明する。A /D変換器22の出力は第1の補正演算回路25に入力 される。まず、第1の補正演算回路25では、先の動作 50 メモリ37は、光学系21の一部にデフォーカス用レン

にてデフォーカス時のレンズシェーディングを除いたシ ェーディング成分のデータが記録されている補正用メモ リ24からデータを読み出す。そして、A/D変換器2 2の出力から補正用メモリ24のデータを減算する。結 果として第1の補正演算回路25からは、対象物に焦点 を合わせたときのレンズシェーディングを除いた補正が 行われた信号が出力される。

【0023】第1の補正演算回路25の出力は第2の補 正演算回路27に入力される。まず、第2の補正演算回 路27では、光学系21の通常のフォーカス状態、つま り対象物に焦点を合わせたときのレンズシェーディング を前もって記憶させてあるレンズシェーディング補正用 メモリ26のデータを読み出す。そして、第1の補正演 算回路25の出力からレンズシェーディング補正用メモ リ26のデータ減算する。結果として第2の補正演算回 路27からは、シェーディングが補正されたビデオ信号 33が出力される。なお参考として図6にレンズシェー ディング補正メモリ26に記憶されている内容の一例を 示す図である。

【0024】上記に示したように対象物体の背景を十分 20 にぼかした時と、対象物体に焦点を合わせた時とでレン ズシェーディングが異なることによって発生するレンズ シェーディングを抑圧することができる。

【0025】実施の形態2.実施の形態1では、被写界 深度が深いレンズ構成の撮像装置では、焦点を十分ぼか すことが不可能な場合がある。本実施の形態は上記問題 を解決するものであり、図7はこの発明の実施の形態2 を示すブロック図である。図7に示す実施の形態におい て1~34は、従来の技術及び先の実施の形態と同様で ある。35は、レンズシェーディングを除いた残りのシ 30 ェーディング量等を測定するため、光学系の一部に組み 込むデフォーカス用レンズ群であり、36はデフォーカ ス用レンズ群を駆動するデフォーカス用レンズ駆動機構 である。また、37はデフォーカスレンズを挿入したと きに発生する特有のレンズシェーディングパターンを記 **憶しているデフォーカスレンズシェーディング補正用メ** モリである。

【0026】以下に動作について説明する。A/D変換 器22の出力までは実施の形態1と同様である。ここ で、切換えスイッチ23を第1の接点31にし、補正用 40 メモリ24に補正データを記憶するときについて説明す る。切換えスイッチ23を第1の接点31にしたとき、 デフォーカス用レンズ駆動機構36が動作し、光学系2 1の一部にデフォーカス用レンズ群35が組み込まれ る。デフォーカス用レンズ群35が組み込まれること で、外界1は、赤外線個体撮像素子16上に結像しなく なる。この状態は実施の形態1で光学系21のフォーカ スを十分にぼかしたときと同様の状態になる。

【0027】デフォーカスレンズシェーディング補正用

ズ群35を組み込んだときに発生する特有のレンズシェーディングパターンが記憶されている。その後の補正データの取り込み及び切換えスイッチ23を第2の接点32にしビデオ信号を出力させる時については実施の形態1と同様である。

【0028】上記に示した様に被写界深度が深いレンズ 構成の撮像装置でも、焦点を十分ぼかすことができる。 またデフォーカスレンズを挿入することで短時間で確実 に焦点を十分にぼかす事ができる。さらに、シェーディ ングを抑圧することができる。

【0029】実施の形態3.実施の形態2では通常使用している状態に、新たにデフォーカス用レンズ群を挿入する。デフォーカス用レンズ群には反射率があるため、それの挿入前後では鏡筒シェーディングが異なる。結果として、鏡筒温度が背景温度と比較して非常に高い場合などには、シェーディング補正後にも鏡筒シェーディングが残る可能性がある。本実施の形態は上記問題を解決するものである。図8はこの発明の実施の形態3を示すブロック図であり1~36は、従来の技術及び先の実施の形態と同様である。38は、外界1を撮像するとき光学系21に組み込まれている通常レンズ群であり、デフォーカスレンズ35と同等の光学系透過率を有している。39はデフォーカス用レンズ群35と通常レンズ群38とを切り換えるレンズ切替え機構である。

【0030】以下に動作について説明する。A/D変換器22の出力までは先の形態と同様である。ここで、切換えスイッチ23を第1の接点31にし、補正用メモリ24に補正データを記憶するときについて説明する。切換えスイッチ23を第1の接点31にしたとき、レンズ切り替え機構39が動作し、いままで光学系21の一部に組み込まれていた通常レンズ群38に代わりにデフォーカス用レンズ群35が組み込まれる。ここで、通常レンズ群38とデフォーカス用レンズ群35とでは、同等の光学系透過率を有しているため、鏡筒反射による鏡筒シェーディングはどちらのレンズを用いても同様の値となる。

【0031】上記に示した様に、鏡筒温度が背景温度と 比較して非常に高い場合などにおいても、鏡筒シェーディングを抑圧することができる。

【0032】実施の形態4. 図9は、この発明の実施の 形態4を示すブロック図であり1~37までは従来の技 術及び先の実施の形態と同様である。40は複数の光学 系を切り換える視野切り替え機構、41は複数のレンズ シェーディング補正用メモリを切り換えるメモリ切替え スイッチである。

【0033】以下に動作について説明する。対象物体と対象物体の背景とから構成された外界1から発せられる赤外線放射20は複数の光学系21に入射する。視野切替え機構40は、複数の光学系を切り換え、赤外線個体素子16上に結像する光学系を選択すると共に、どの光 50

学系を用いているかの情報をメモリ切替えスイッチ41 に送る。入射した赤外線は、視野切り替え機構40によ って選択された光学系を通して赤外線固体撮像素子16 上に結像する。切り換えスイッチ23を第1の接点31 にし補正用メモリ24に補正データを記憶する手法は実 施の形態1と同様である。次に、切換えスイッチ23を 第2の接点32にし、ビデオ信号を出力するときには、 A/D変換器22の出力は第1の補正演算回路25に入 力される。第1の補正演算回路25では補正用メモリ2 4の出力を減算することでレンズシェーディングを除い 10 た残りのシェーディング成分等を補正する。メモリ切り 換えスイッチ41は、視野切換え機構40によって選択 された光学系のレンズシェーディングパターンを、レン ズシェーディング補正用メモリ26から選択し第2の補 正演算回路27に出力する。第2の補正演算回路27で は、前記第1の補正演算回路25の出力からレンズシェ ーディングメモリ補正用メモリ26のデータを減算し、 これによりシェーディング補正を行う。

【0034】上記に示した様に、異なる複数の光学系に対して複数のレンズシェーディング補正用メモリを持つことで、レンズシェーディングを補正することができる。

【0035】実施の形態5.図10は、この発明の実施の形態5を示すブロック図である。図において、1~34は先の実施の形態と同じである。図10において42は鏡筒シェーディング補正用メモリであり、レンズシェーディングを除いた残りのシェーディング補正データを記憶する。43は第3の補正演算回路であり、鏡筒シェーディング補正用メモリの出力を用いてレンズシェーディング以外の成分の補正を行う。44は反射率が高いシャッターであり、45はシャッター開閉機構である。46は、レンズシェーディングを除いた残りのシェーディング量等を測定する鏡筒シェーディング測定回路であり、47は切換えスイッチ23が鏡筒シェーディング測定回路の方につながる第3の接点である。

【0036】次に動作について説明する。A/D変換2 2の出力までは先の実施例と同様である。まず、切換え スイッチ23を第3の接点47にし、鏡筒シェーディン グ補正用メモリにデータを記憶するときについて説明す る。切換えスイッチ23を第3の接点47にすると共 に、シャッター開閉機構45により反射率が高いシャッ ター44で光学系21の前面をおおう。一般的に赤外線 個体撮像素子16は暗電流を抑圧するために極低温に保 たれている。シャッター44の反射率が高いためシャッ ター自身からの放射はほとんどなく、赤外線個体撮像素 子16の極低温部分を反射することになる。赤外線個体 素子16の温度は、鏡筒温度と比較して十分低く赤外線 の放射量は無視できる。結果として、A/D変換器22 の出力としては、鏡筒により発生するシェーディングが 出力される。このイメージ図を図11に示す。48は鏡 筒であり、49はレンズによる鏡筒反射成分、50は赤 外線個体撮像素子16の反射成分である。鏡筒シェーデ ィング測定回路46にてA/D変換器22の出力を鏡筒 シェーディング補正用メモリに記憶する。このようにし て、レンズシェーディングを除いた残りのシェーディン グ量等を、鏡筒シェーディング補正用メモリに記憶され る。その後の動作に関しては先の実施例と同様である。

【0037】上記に示したようにシャッターの反射率が 高いため、シャッター温度に左右されることなく補正を 行う事ができる。

【0038】実施の形態6. 図12はこの発明の実施の 形態6を示す図である。44は反射率が高いシャッター であり、図12に示す様な形状をしている。このシャッ ターの特徴は、入射した方向と同じ方向に赤外線を反射 することである。

【0039】このように、入射した方向と同じ方向に赤 外線を反射するため、シャッター44が赤外線個体撮像 素子16の低温部分しか見ず、実施の形態5よりもシャ ッター温度に左右されることなく補正を行う事ができ

【0040】実施の形態7. 図13は、この発明の実施 の形態7を示すブロック図である。図13において、5 1は背景温度と比較して温度の低い低温度源であり、そ の他は、実施の形態5と同様である。

【0041】次に動作について説明する。A/D変換2 2の出力までは先の実施例と同様である。まず、切換え スイッチ23を第3の接点47にし、鏡筒シェーディン グ補正用メモリにデータを記憶するときに関して説明す る。切換えスイッチ23を第3の接点47にすると共 に、シャッター開閉機構45により反射率が高いシャッ ター44が光学系21の前面をおおう。このとき、反射 率が高いシャッター44の反射方向は低温度源51であ り、赤外線個体素子16には低温度源51が撮像され る。このイメージ図を図14に示す。その後の動作に関 しては実施の形態5と同様である。

【0042】上記に示したようにシャッターの反射率が 高く、その反射方向に低温度源を設置することで、シャ ッター温度に左右されることなく補正を行う事ができ る。

# [0043]

【発明の効果】この発明の実施の形態1によれば、背景 を十分にぼかした時と、対象物体に焦点を合わせた時と でレンズシェーディングが異なることによって発生する レンズシェーディングを抑圧することができる。

【0044】この発明の実施の形態2によれば、被写界 深度が深いレンズ構成の撮像装置でも、焦点を十分ぼか すことができる。また、デフォーカスレンズを挿入する ことで短時間で確実に焦点を十分にぼかす事ができる。 さらに、シェーディングを抑圧することができる。

度が背景温度と比較して非常に高い場合などにおいて も、鏡筒シェーディングを抑圧することができる。

【0046】この発明の実施の形態4によれば、異なる 複数の光学系に対して複数のレンズシェーディング補正 用メモリを持つことで、レンズシェーディングを補正す ることができる。

【0047】この発明の実施の形態5によれば、シャッ ターの反射率が高いため、シャッター温度に左右される ことなく補正を行う事ができる。

【0048】この発明の実施の形態6によれば、シャッ 10 ターの反射率が高いため、実施の形態5よりもシャッタ 一温度に左右されることなく補正を行う事ができる。

【0049】この発明の実施の形態?によれば、シャッ ター温度に左右されることなく補正を行う事ができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明による赤外線撮像装置の実施の形態 1を示す図である。

【図2】 A/D変換器の出力を示す図である。

図2のA-A'の輝度分布を示す図である。 【図3】

20 【図4】 シェーディングパターンの一例を示す図であ る。

[図5] 補正用メモリに記憶されている内容の一部分 を示す図である。

レンズシェーディング補正メモリに記憶され 【図6】 ている内容の一部分を示す図である。

【図7】 この発明による赤外線撮像装置の実施の形態 2を示す図である。

【図8】 この発明による赤外線撮像装置の実施の形態 3を示す図である。

【図9】 この発明による赤外線撮像装置の実施の形態 30 4を示す図である。

【図10】 この発明による赤外線撮像装置の実施の形 態5を示す図である。

【図11】 反射成分のイメージ図である。

【図12】 この発明による赤外線撮像装置の実施の形 態6を示す図である。

【図13】 この発明による赤外線撮像装置の実施の形 態7を示す図である。

【図14】 温度源とシャッターとの関係を示す図であ 40 る。

【図15】 従来技術を示す図である。

【図16】 従来技術を示す図である。

【図17】 従来技術を示す図である。

# 【符号の説明】

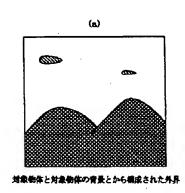
1 外界、2 赤外線を集光するレンズ、3 撮像部、 4 補正データ記憶部、5 複数の画素からなる赤外線 検出素子、6 第1レンズ系、7 第2レンズ系、8 第2レンズ系の結像位置、9 セレクタ、10 減算 器、11 テレビ信号用フォーマット変換器、12 フ

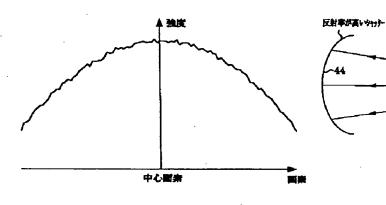
【0045】この発明の実施の形態3によれば、鏡筒温 50 レームメモリ、13 補正制御器、14シャッタ、15

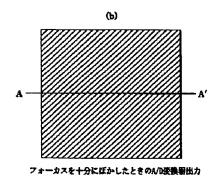
シャッタ駆動器、16 赤外線固体撮像素子、17 赤外線レンズ、18 信号処理系、19 赤外線撮像装置、20 外界から発せられる赤外線放射、21 光学系、22 A/D変換器、23 切換えスイッチ、24 補正用メモリ、25 第1の補正演算回路、26 レンズシェーディング補正用メモリ、27 第2の補正演算回路、28 フォーカス調整機構、29 デフォーカス時用補正メモリ、30 補正量演算回路、31 第1の接点、32 第2の接点、33 ビデオ出力信号、34 モニタ、35 デフォーカス用レンズ群、36 デフ

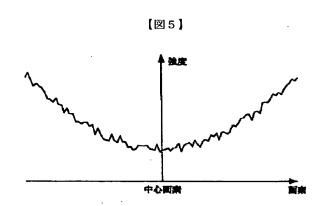
オーカス用レンズ起動機構、37 デフォーカスレンズシェーディング補正用メモリ、38 通常レンズ群、39 レンズ切替え機構、40 視野切り替え機構、41 メモリ切り替えスイッチ、42 鏡筒シェーディング補正用メモリ、43 第3の補正演算回路、44 反射率が高いシャッター、45シャッター開閉機構、46 鏡筒シェーディング測定回路、47 第3の接点、48 鏡筒、49 鏡筒からの反射成分、50 赤外線個体撮像素子の反射成分、51 低温度源。

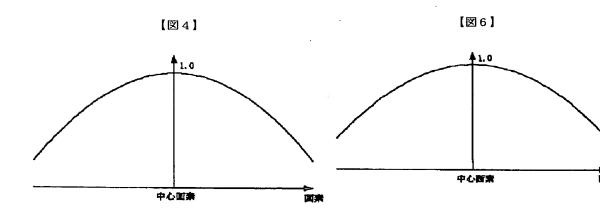
10



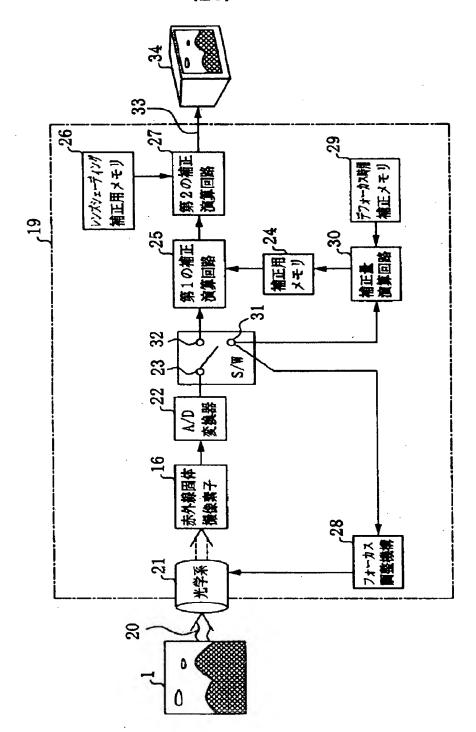




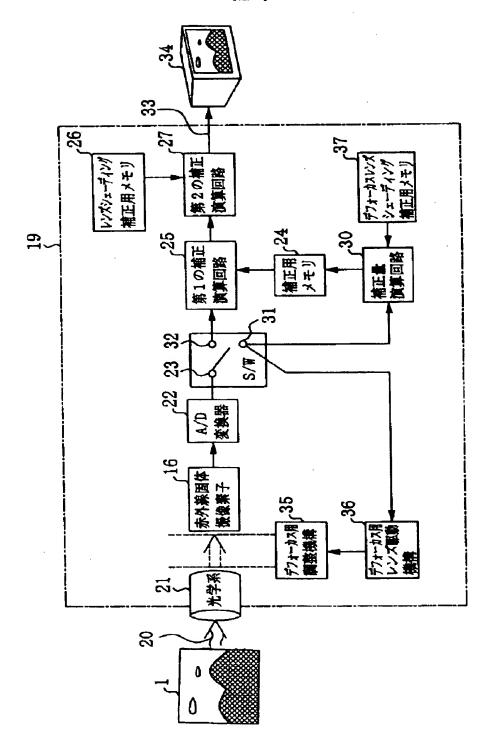




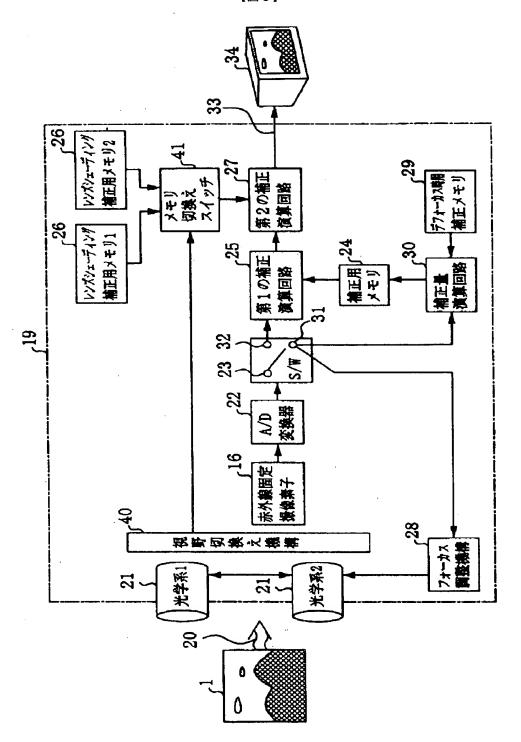
【図1】



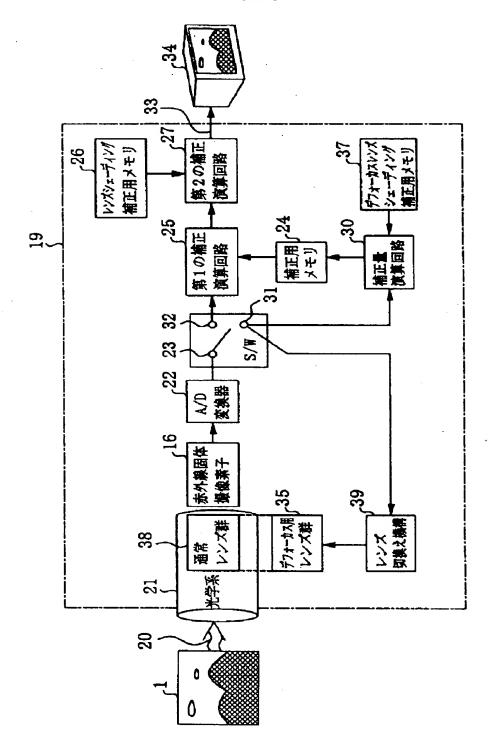
【図7】



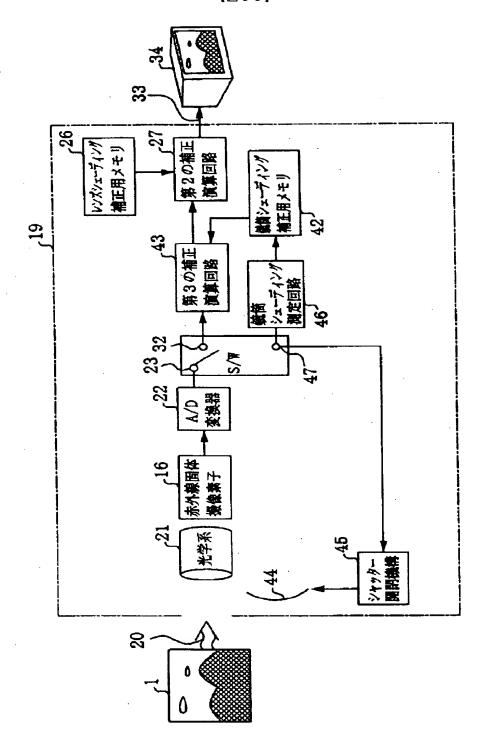
【図8】

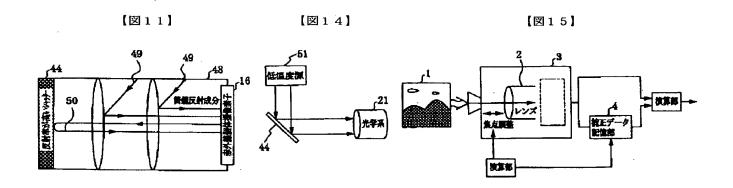


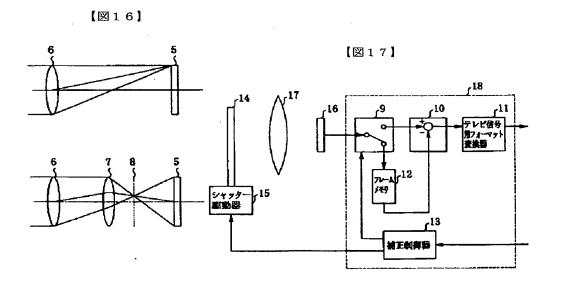
【図9】



【図10】







【図13】

